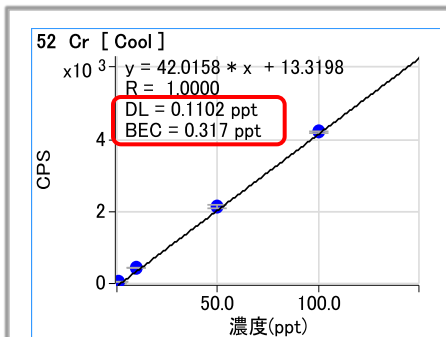


微量金属元素の高感度分析

最新型のICP-MS(誘導結合プラズマ質量分析装置)を導入いたしました。
ICP-MSは『高感度分析』『多元素同時測定』『同位体分析』が可能です。

高感度分析



検出下限値※(DL)とバックグラウンド相当濃度※(BEC)が1ppt以下であり、pptオーダーの高感度分析が可能です。



測定可能元素

H,C,N,O,希ガス,放射性同位体は測定対象外

※水溶液試料の測定例。測定オーダーは、試料材質やマトリクス、対象元素によって異なります。

	ICP-MS	ICP-OES	AAS
分析範囲	ppt~ppm	ppb~%	ppb~ppm
ダイミックス	9桁	6桁	2桁
マトリクスの影響	△	○	○
多元素同時分析	○	○	×
同位体分析	◎	×	×

ICP-OES: 誘導結合プラズマ発光分光分析装置

AAS: 原子吸光光度計

多元素同時分析 同位体分析

高感度装置と独自の前処理技術で、幅広い濃度範囲での含有元素を迅速に分析します。



誘導結合プラズマ質量分析装置(ICP-MS)
アジレントテクノロジー製 Agilent 7700

<測定例>

- 半導体材料関連評価
(ウェハ、フォトリソ、洗浄液などに含有する微量不純物分析)
- 高純度金属材料中の微量不純物分析
- 環境試料(海水、河川水)中の重金属含有量調査
- 使用済み製品中のレアメタル含有量測定
- RoHS, REACH, ELV指令などの規制物質含有量測定

豊富な経験と実績で幅広い分野での微量元素分析に対応します。お気軽にお問合せください。

ホームページ <http://www.hitachi-chem-ts.co.jp>

受託分析のご依頼、ご質問は <https://www8.hitachi.co.jp/inquiry/hitachi-chem-ts/general/form.jsp>